

인사말

안녕하십니까? 한국정밀공학회(KSPE)의 나노/マイクロ 부문위원장을 맡고 있는 카이스트의 김승우 교수입니다. 작년 2월 학회의 새로운 사업으로 “정밀측정 심포지움 – 전문인 기술교류–” PMS2006 행사를 성공적으로 개최하였고, 올해에도 본 한국의 정밀측정 기술의 지속적인 발전을 도모하고자 PMS2007을 개최합니다. 이번 행사는 2007년 4월 20일(금) 하루에 걸쳐 대전 카이스트에서 개최됩니다.

한국의 정밀측정기술은 한국의 정밀산업의 발전과 더불어 지난 10여년간 비약적인 발전을 보여 왔습니다. 그간 적지 않은 수의 중소기업, 대기업들이 반도체와 디스플레이의 검사기술의 국산화 및 선진화에 공헌하고 있으며, 조만간 1조원 규모의 국산화 검사 설비의 매출시장이 형성될 것으로 기대하고 하고 있습니다.

이러한 기술 사회적 배경을 기반으로 본 심포지움은 국내의 정밀측정 전문인들의 기술교류 포럼의 역할을 수행하고자 합니다. 이는 국내 정밀측정인들이 한 곳에 모여 서로의 기술을 소개하고 더불어 국내 측정산업의 발전에 대한 공동 전략에 대한 토의의 장을 갖고자 합니다. 또한 필요한 경우 정부의 측정검사기술에 대한 R&D 투자에 견의를 위한 의견 수렴이 기회도 갖고자 합니다.

이상의 제반 취지와 목적을 성공적으로 달성을 할 수 있는 심포지움의 시작을 위해 회원 여러분들의 많은 참여를 기대하겠습니다. 이와 더불어 2007년 새해에도 항상 건강하시고 하시는 일의 건승을 기원합니다. 감사합니다.

2007. 1.

KSPE 나노/マイクロ 부문위원장 김 승 우

찾아오시는 길

한국과학기술원 건물안내도



» 장소: 카이스트 기계공학동 (N7) 1층 공동 강의실

등록안내

• 등록기간 (현장등록도 가능)

- 2007년 3월 5일(월) ~ 4월 13일(금)

• 등록비 (교재비, 종식 포함)

- 일반 : 70,000원 (현장등록시 90,000원)
- 학생 : 30,000원 (현장등록시 50,000원)

• 사전등록신청

- 은행입금 : 2007년 3월 5일(월) ~ 4월 13일(금)
- 계좌번호 : 우리은행 270-003359-13-137
(예금주 : 한국과학기술원)

- 수강자 이름으로 입금하신 후, 참가신청서와 입금증을 Fax(042-869-5217)로 보내주시오.(학생은 학생증사본 또는 재학증명서첨부)



정밀측정 심포지움

- 전문인 기술교류 -

▶ 일 시 : 2007년 4월 20일(금)

▶ 장 소 : 카이스트 기계공학동

▶ 주 관 : 한국정밀공학회

KSPE

한국정밀공학회

Korean Society of Precision Engineering

심포지움 시간표

2007년 4월 20(금)	
09:00 ~ 09:30	등록
09:30 ~ 12:20	Session I. 전문기초 기술분야 휴식 (10:45 ~ 11:05)
12:20 ~ 13:00	점심식사
13:00 ~ 17:25	Session II. 산업응용 기술분야 휴식 (14:15 ~ 14:35) (15:50 ~ 16:10)
17:30 ~ 18:00	Session III. Round Table : 한국 정밀측정 기술의 발전을 위한 공조 방안
18:00 ~ 20:00	Banquet

세부 프로그램

Session I. 전문기초 기술분야

09:30 ~ 09:55

초고출력 펨토초 레이저 기반의 연X선 광원과 정밀측정에의 응용
김형택 박사 (고등광기술연구소)

09:55 ~ 10:20

엑스선 현미경 및 나노토모그라피 개발
윤권하 교수 (원광대)

10:20 ~ 10:45

Ellipsometry 분석의 CD 측정에의 응용
김영동 교수 (경희대)

11:05 ~ 11:30

이온빔 이용 나노급 복합가공기 개발
장동영 교수 (서울산업대)

11:30 ~ 11:55

첨단 X-선 영상과 나노/마이크로 측정
제정호 교수 (포항공대)

11:55 ~ 12:20

펨토초 레이저 응용 절대거리 측정
진종한 박사 (KAIST)

Session II. 산업응용 기술분야

13:00 ~ 13:25

대구경 광학계 평가 기술
양호순 박사 (KRISS)

13:25 ~ 13:50

VCM(voice coil motor)을 이용한 3차원 나노형상 측정시스템
박기환 교수 (GIST)

13:50 ~ 14:15

비접촉 측정기의 산업체 적용
김성철 박사 (덕인)

14:35 ~ 15:00

LCD Rubbing Angle의 in-situ 측정
정대화 박사 (LG전자)

15:00 ~ 15:25

반도체 패키징 분야에서의 비전 검사기술
이상윤 박사 (인텍플러스)



15:25 ~ 15:50

전자산업에서의 고속 광계측기술의 역할
김대석 박사 (삼성전자)

16:10 ~ 16:35

LCD 평판유리 제조산업에서의 검사측정기술의 수요
김태호 박사 (삼성코닝정밀유리)

16:35 ~ 17:00

천문우주용 적외선 비구면 광학계의 형상측정
김건희 박사 (한국기초자원연구원)

17:00 ~ 17:25

길이표준 및 이의 산업적 응용
김재완 박사 (KRISS)

Session III. Round Table

17:30 ~ 18:00

한국 정밀측정 기술의 발전을 위한 공조 방안

문의 및 연락처

- 전화 : 042-869-3217 (김승우 교수)
042-869-8206 (등록 및 접수 관련: 김미영)
042-869-3257 (심포지움 관련: 진종한)
- 팩스 : 042-869-5217
- 주소 : 대전시 유성구 구성동 373-1, 카이스트,
기계공학과, 정밀측정연구실 (305-701)
- URL : <http://pem.kaist.ac.kr/pms2007>